

# 固体径迹探测器测量绝对中子注量率 的一种简便法

史永谦 兰义正 李义国  
郑伍钦 李富民 朱国盛

(中国原子能科学研究院, 北京)

文章叙述了用  $4\pi\beta-\gamma$  符合仪器测量金箔的活性, 求得所测中子场的绝对中子注量率, 然后对固体径迹探测器进行刻度。由于将几个因子归并为一个简单系数, 简化了公式, 用时十分方便。本方法适用于任何厚度的裂变源。

**关键词** 绝对中子注量率, 固体径迹探测器(SSNTD), 刻度, 裂变源。

## 一、引言

在研究性反应堆中, 常常需要提供实验孔道或实验回路中某些位置的绝对中子注量率; 在一个新堆物理启动后, 仪表指示值, 要正确反应实验孔道的绝对注量率, 需要用实际测量值来调整; 另外, 对其他中子场, 也往往需要确定某一点或某些位置的绝对注量率。而测量精度较高的方法是用  $4\pi\beta-\gamma$  符合仪器测量金箔在被测中子场中辐照后的绝对活性。在很多单位, 并不都备有  $4\pi\beta-\gamma$  符合测量装置, 因此固体径迹探测器就以它独有的优点, 即原理简单、能经受强  $\gamma$  辐照、可长期保存, 而被广泛采用<sup>[1-5]</sup>。不过测量前要作大量工作, 特别是当裂变源中可裂变原子数无法确定时, 困难更多。我们利用金箔和固体径迹探测器同时在中子场中进行辐照, 在  $4\pi\beta-\gamma$  符合仪器上测量金箔的活性, 求得绝对中子注量率, 然后对固体径迹探测器进行刻度。由于所用公式中的几个因子简化为一个系数, 只要测量出固定视野面积内,  $m$  个固定视野的平均径迹数  $\bar{N}$ , 就可得到绝对中子注量率  $\phi$ 。

$$\phi = A \frac{\bar{N}}{T} \quad (1)$$

$$A = n / (N \sigma_f \epsilon \eta) \quad (2)$$

其中  $T$  为照射时间,  $A$  为简化系数,  $n$  为裂变源面积内固定视野的个数,  $n\bar{N}$  即为径迹探测器上总径迹数,  $N$  为裂变源的可裂变原子数,  $\sigma_f$  为有效裂变截面,  $\epsilon$  为探测器效率,  $\eta$  为裂变源对裂变碎片的自吸收因子。对同一个裂变靶、类似的中子能谱以及刻度后的显微镜,  $N$ ,  $\sigma$ ,  $\epsilon$ ,  $\eta$ ,  $n$  应为常数。

## 二、测量结果

刻度是在微型反应堆的原型堆上进行的, 所用参数及结果如表 1 所示。其中  $\phi_{\text{金}}$  为金

表 1 刻 度 所 用 参 数  
Table 1 Parameter used for graduation

$\phi_{\text{金}}/\text{n}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{cm}^{-2}$	$T/\text{s}$	$m/\text{次}$	$\bar{N}/\text{单位视野}$	$A$
$5 \times 10^8$	300	140	$102.4 \pm 1.8$	$1.466 \times 10^{10}$
$5 \times 10^8$	180	130	$61.5 \pm 1.1$	$1.463 \times 10^{10}$

箔测量的绝对注量率。

由表 1 得出,  $A$  的平均值为  $1.465 \times 10^{10}$ 。代入式(1)得到:

$$\phi = 1.465 \times 10^{10} \frac{\bar{N}}{T} \quad (3)$$

此公式在商用微型反应堆上进行了检验, 并与金箔活性测量结果进行比较, 表 2 为固体径迹探测器测量结果, 表 3 为金箔活性测量结果。

表 2 用公式(3)测量参数及结果

Table 2 Results and parameters measured according to formula(3)

$\phi_{\text{仪}}/\text{n}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{cm}^{-2}$	$T/\text{s}$	$\bar{N}/\text{单位视野}$	$\phi_{\text{固}}/\text{n}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{cm}^{-2}$	$\phi_{\text{仪}}/\phi_{\text{固}}$
$8.33 \times 10^8$	243	8.88	$5.35 \times 10^8$	1.56
$8.40 \times 10^8$	421	15.83	$5.51 \times 10^8$	1.52
$42.16 \times 10^8$	199	35.76	$26.33 \times 10^8$	1.60
$42.18 \times 10^8$	240	42.68	$26.05 \times 10^8$	1.62
$78.98 \times 10^8$	120	43.27	$52.83 \times 10^8$	1.49
$401.25 \times 10^8$	59.5	100.04	$246.32 \times 10^8$	1.63

表 3 金箔活性测量结果

Table 3 Results measured by gold activity

$\phi_{\text{仪}}/\text{n}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{cm}^{-2}$	金箔位置*	$\phi_{\text{金}}/\text{n}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{cm}^{-2}$	$\phi_{\text{仪}}/\phi_{\text{金}}$
$10.74 \times 10^9$	下	$6.56 \times 10^9$	1.64
	上	$6.71 \times 10^9$	1.60
$5.55 \times 10^{10}$	下	$3.47 \times 10^{10}$	1.60
	上	$3.24 \times 10^{10}$	1.71
$10.76 \times 10^{10}$	下	$6.66 \times 10^{10}$	1.62
	上	$6.72 \times 10^{10}$	1.60
$5.40 \times 10^{11}$	下	$3.53 \times 10^{11}$	1.53
	上	$3.31 \times 10^{11}$	1.63

\* 金箔位置是用同一个辐照盒, 一个金箔放在上面, 一个金箔放在下面, 二者相距5cm。

在表 2 和 3 中,  $\phi_{\text{仪}}$  为微型堆启动时的指示值,  $\phi_{\text{固}}$  和  $\phi_{\text{金}}$  为实际测量值。从二者之比来调整仪表指示值, 使之与实际测量值相符合, 即调整仪表指示值, 使它们的比值为 1。从表 2 可以得出, 仪表指示值偏高于固体径迹探测器结果, 它们之比平均为:  $1.57 \pm 0.05$ 。从表 3 可以得出, 仪表指示值偏高于金箔活性结果, 它们之比平均为:  $1.62 \pm 0.05$ 。

以上结果看出：二者在误差范围内是符合的。因此，用固体径迹探测器测量注量率的简便方法是成功的。后来在巴基斯坦微型反应堆上应用，也得到了满意的结果。

### 三、讨 论

1. 此方法特别适用于测量高中子注量率的中子场。例如，在中子注量率大于  $10^{10} \text{ n} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2}$  时，所用裂变源的  $^{235}\text{U}$  原子数无法用常规方法确定，限制了固体径迹探测器测量绝对注量率的应用范围，而这个方法弥补了它的不足。

2. 如果用天然铀作为裂变源，而测中子场的能谱较硬，这样快中子可能引起  $^{238}\text{U}$  原子的快裂变，也就是  $^{238}\text{U}$  的快裂变形成的径迹对总径迹计数的贡献不能忽略。但公式还是可以应用的。在用金箔刻度时，可以假定被测中子场中热中子注量与快中子注量率之比是一个常数，即：

$$a = \phi_f / \phi_{th}$$

其中  $\phi_f$  为快中子注量率， $\phi_{th}$  为热中子注量率。这样得到的径迹由两部分组成：热中子引起的  $^{238}\text{U}$  原子裂变形成的径迹和超过  $^{238}\text{U}$  裂变阈的快中子引起的裂变所形成的径迹，即：

$$\begin{aligned} N_T &= \bar{N}n = [{}^5N\sigma_{f5}\phi_{th}T\epsilon\eta + {}^8N\sigma_{f8}\phi_fT\epsilon\eta] \\ &= [{}^5N\sigma_{f5}\epsilon\eta + a^8N\sigma_{f8}\epsilon\eta]T\phi_{th} \\ &= AT\phi_{th} \end{aligned}$$

则测量热中子绝对注量率仍可用简便公式。

3. 测量不同量程的中子注量率，要用不同的裂变源，因此系数  $A$  是不一样的。

4. 该方法适用范围是待测中子场和所刻度时用中子场能谱近似，如果能谱差别较大测量结果将会带来一定误差。

5. 刻度中是将金箔和固体径迹探测器一起放在一个辐照盒内进行照射，这样两种材料可能有干扰。我们用一个金箔在一个辐照盒内和两个金箔在一个辐照盒内辐照，结果注量率相差 2%。但从表 3 看出，上下位置测量值误差为 3%，因此可以认为刻度时的干扰是在测量误差范围内。

感谢王珂、曲桂茹和陈绍能在原型反应堆辐照时给予的帮助。

### 参 考 文 献

- [1] 史永谦等，原子能科学技术，(1)，108(1985)。
- [2] 路富强，核技术，(4)，36(1985)。
- [3] 郭士伦等，原子能科学技术，(1)，81(1981)。
- [4] 刘顺生等，核技术，(1)，38(1985)。
- [5] 李焕铁等，原子能科学技术，(1)，58(1976)。

(编辑部收到日期：1990 年 5 月 23 日)

# A SIMPLE METHOD FOR THE DETERMINATION OF ABSOLUTE NEUTRON FLUX RATE BY SSNTD

SHI YONGQIAN LAN YIZHENG LI YIGUO  
ZHENG WUQING LI FUMIN ZHU GUOSHENG

(*China Institute of Atomic Energy, P. O. Box 275, Beijing*)

## ABSTRACT

For the determination of absolute neutron flux rate, the SSNTD graduation method, which is calibrated by measuring the Au activity on  $4\pi\beta-\gamma$  coincidence installation, is discussed in the paper.

**Key words** Absolute neutron flux rate, Solid state nuclear track detector (SSNTD), Graduation, Fission source.